

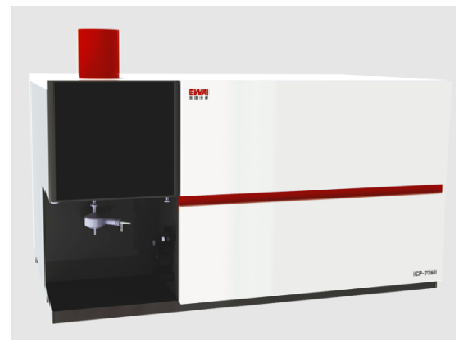


ICP-7760HP Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой

Полноспектральный ICP-OES для многоэлементного анализа.

Одновременное получение полного спектра всех элементов в образце; Эшелле-дисперсионная технология минимизирует ошибки, вызванные спектральными помехами, отвечая требованиям анализа сложных образцов; мегапиксельная научная ПЗС-матрица с защитой от засветки повышает точность как качественных, так и количественных данных, а ее конструкция эффективно улучшает отношение сигнал / шум при анализе следовых количеств и значительно снижает предел обнаружения.

Спектральный мониторинг в реальном времени позволяет быстро оптимизировать параметры прибора и анализа.



- Прямой качественный анализ неизвестных образцов без использования стандартных растворов или разработки методики. Полноэлементный анализ даже при ограниченном объеме образца.
- Сокращение времени анализа и расхода аргона для снижения эксплуатационных расходов.
- Ретроспективный анализ: можно сначала получить спектры, затем определить элементы.
- Одновременный сбор фоновых сигнала и сигнала аналита для повышения точности.
- Оптимизация положения источника и высоты наблюдения с помощью электропривода для достижения максимальной интенсивности сигнала.

ICP-7762 Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой

ИСП спектрометр ICP-7762 использует технологию двойного обзора с вертикальным горелкой. Вертикальная горелка предотвращает отложение большого количества солей, тем самым продлевая срок службы горелки. Осевого обзора обеспечивает низкие пределы обнаружения и высокую чувствительность, а радиальный обзор позволяет избежать матричных помех. Одновременный обзор обеспечивает баланс между осевым и радиальным наблюдениями, предлагая относительно высокую чувствительность и частично компенсируя матричные эффекты.

- **Диапазон длин волн:** 165 ~ 800 нм.
- **Одновременный сбор данных:** Обеспечивает одновременный сбор данных по всем элементам выборки во всем спектре.
- **Качественный анализ:** Возможность проведения качественного анализа неизвестных образцов без необходимости приготовления стандартных растворов или разработки методик.
- **Метод наблюдения:** технология вертикального двойного обзора с помощью фонаря.
- **Система продувки газом:** ПЗС-матрица и оптическая камера продуваются независимо друг от друга. ПЗС-матрица оснащена функцией автоматической продувки, которая динамически регулирует поток газа в зависимости от уровня влажности, что не только повышает скорость продувки, но и экономит газ. Кроме того, независимая система продувки позволяет использовать в качестве продувочного газа исключительно азот, что снижает эксплуатационные расходы.



ICP-7700 Спектрометр эмиссии с индуктивно связанной плазмой

ICP-7700 - атомно-эмиссионный ICP-OES для быстрого определения микро- и макрокonzентраций элементов с высокой чувствительностью и стабильностью.

В устройстве используется твердотельный радиочастотный генератор и осевой режим наблюдения, что обеспечивает низкий предел обнаружения, высокое разрешение, стабильную работу и широкий диапазон применения. Оно позволяет быстро и точно обнаруживать около 70 элементов, от микроуровней до макроскопических.



- Твердотельный ВЧ-генератор на основе ИСП: малый размер, легкий вес, высокая эффективность, с функцией автоматического согласования, стабильность выходной мощности лучше 0,1%.
- В этом радиочастотном генераторе используется технология синтеза мощности, что обеспечивает длительный срок службы, надежную работу и простоту обслуживания.
- Режим наблюдения: осевой, характеризующийся низким пределом обнаружения.
- Система впрыска: используется прецизионный расходомер, обеспечивающий стабильность и надежность. Усовершенствованная туманообразующая камера, повторяемость относительного стандартного отклонения достигает < 1,0%.
- Автоматическая защита: отключение подачи воды, газа, защиты от перегрузки по току, перегрева, предотвращение плавления трубки горелки и т.д.
- Программное обеспечение включает в себя такие функции, как вычитание пустого значения, вычитание фонового значения, автоматическое сканирование интерференционных линий, метод построения стандартной кривой, метод стандартных добавок и т.д.